向科学技術振興財団 研究助成成果報告書

He 分離プロセスに適用可能なシリカ系多孔膜

の細孔構造制御法の提案

Proposal of Pore Structure Controllability for Porous Silica-based Membranes Applicable to He Separation Processes

助成年度	令和6年度研究助成
助成番号	MZR2024007
研究期間	2024/04/01 ~ 2025/03/31
代表研究者	金指 正言 (Kanezashi Masakoto)
	広島大学 大学院先進理工系科学研究科 化学工学プログラム
キーワード	膜分離,アモルファスシリカ,細孔径制御,分離ふるい

1. 研究の背景と目的

He は分子径が最も小さく、最も沸点(-269℃) が低いガスで、不活性、高熱伝導率、高拡散性な どの特性を有する。冷却目的では N2, 不活性を生 かす目的では Ar などで代替できるが、複数の特 性を必要とする場合は他のガスで代替ができな い。例えば、半導体、光ファイバー、分析のキャ リアガス,ウエハー製造工程,超電導磁石 (MRI, リニアモーターカー)の冷却用ガス、低温工学、飛 行船等の用途である。日本の販売構成比率は半導 体, MRI, 光ファイバーで全体の 42% (2021 年, 日本産業・医療ガス協会)を占めており,必要不可 欠なガスである。He の核融合による人工合成は研 究途上で、低コスト・大量生産は不可能である。 現在使用されている He は地下に埋蔵する可燃性 ガス (CH4 主体)や不燃性ガス田 (N2 主体)に随伴 して生産されたものである。近年、世界的に需要 と供給のバランスが崩れており、100%輸入に依存 している我が国は、入手困難な状況が続いている。

一般にガス田に含まれる He は微量であり、He 濃度は 0.1~3%に過ぎない。ガス田からの He 回収 に膜分離技術を適用する場合,有機高分子膜は, 耐圧、耐熱性の点で分離・回収の運転条件に制約 がある。そのため、耐圧性、耐熱性を有する無機 材料を用いることで、地下ガス層の温度・圧力エ ネルギーを活用した高差圧分離が可能となり、省 エネ・低環境負荷の高効率分離プロセスを実現で きる。シリカ系多孔膜はSi, 0, Hからなり, Si-0-Siからなるシロキサン結合を骨格とするSi4~ Si8 員環を主とするアモルファス構造を有する。 HeはSi6員環以上の細孔を透過することができ、 無機材料で唯一 He 分離に適している [1]。He 分 離の分離対象 (He (0.26 nm), N₂ (0.36 nm), CH₄ (0.38 nm))は、いずれも膜との吸着性が小さいた め、分子ふるいをベースにした細孔径制御が重要 である。従来のシリカ系多孔膜は、Si4~5員環が 全空隙率の 50%を占める緻密な構造を有する [2]。 He 透過性は温度依存性が大きく、高温 (> 400℃)

で高透過性を示すが、ガス噴出温度(80-150℃)で は透過性が大きく低下する。また、分離対象の№ や CH4 は、その分子サイズから緻密構造を透過で きず、膜内のピンホールを Knudsen 拡散により透 過するため、低温ほど透過性が大きくなり、He 選 択性は低温ほど大きく低下する点に課題を有す る。№ や CH4 の透過性を制御することは極めて重 要な研究課題であり、Knudsen 拡散の透過流束式 より、He 選択性が発現する 0.3 nm 以下の透過性 は、Knudsen 拡散よりもずっと小さく、例えば、 ピンホールの細孔径が 2 nm 程度であれば、その 割合を 0.3 %以下に制御する必要があり、ピンホ ールフリーでの製膜は極めてチャレンジングで ある。

本研究では、高選択透過膜開発を目的とし、図 1 に示すように Co が有機キレートと配位した金 属錯体を用い、SiO₂との共重合により複合酸化物 (Si-O-Co)を形成した。また、所定の条件でアモル ファス構造内の有機キレート配位子をカーボン 化 させ、ネットワーク構造を制御し、細孔径や気 体透過性に及ぶす影響を評価した。



図1 有機キレートを用いたシリカネットワーク形成概略図

- 2. 研究の内容・方法
- (1) ゾル調製と製膜

TEOS と Co-(acac) 3 をエタノール溶媒中で 12 時

間攪拌することで加水分解,縮重合させ,Si0₂-Co-(acac)₃ ゾルを調製した。製膜は、多孔質 α -アル ミナ管外表面を平滑化するために、 α -アルミナ 微粒子を担持、焼成を数回繰り返した後、Y-Si0₂-Zr0₂ ゾルを塗布し、数 nm 程度の中間層を形成さ せた [3]。中間層上にSi0₂-Co-(acac)₃ ゾルを塗 布し、分離に活性な薄膜層を形成させた。焼成温 度は 250-750 °C、N₂雰囲気で 15 分間焼成した。

(2)気体透過実験

各焼成温度で作製した膜は図2に示す加圧型気 体透過試験装置を用い、50-500 ℃で純ガス(He, H₂, CO₂, N₂, CH₄, C₃H₆, C₃H₈, SF₆)の分子径依存 性,温度依存性を評価した。



図 2 気体透過試験装置概略図

3. 研究の成果

(1)焼成温度と SiO₂-Co-(acac)₃構造の関係

図3に,Si02-Co-(acac)3ゲルの各焼成温度にお けるClsスペクトルを示す。250℃では炭素は有 機物として存在していたが,焼成温度が高くなる につれてC-C sp²結合が支配的になった。焼成温 度750℃では,Clsの90%以上がC-C sp²結合に なり,遊離残留炭素として存在する可能性が示さ れた。キレート配位子として配位した炭素は,焼 成温度に関係なく残留し,完全に除去されないこ とが明らかになった。

図 4 に SiO₂-Co-(acac)₃ ゲルの各焼成温度にお ける XRD パターンを示す。250-750 ℃ の N₂ 雰囲気 で焼成したすべての SiO₂-Co-(acac)₃ 試料は, 21 ~26°にアモルファスハローピークを示した. 焼成温度が 550 ℃以下では, Co の結晶化が確認 されず, アモルファス構造であった。一方, 650 ℃ 以上では, ピーク強度は弱いものの, 2 θ = 44° に Co 酸化物のピークが検出された。焼成温度 750 ℃では, 結晶化が促進され, 2 θ = 42°のピー クも確認された。これらは, 42.4°の CoO の (200) ピーク, 44°と 51°の Co₃O₄の (111) と (311) ピー クであった。



図 3 SiO₂-Co-(acac)₃ ゲルの各焼成温度における C1s スペ

クトル



図 4 SiO₂-Co-(acac)₃ ゲルの各焼成温度における XRD パタ ーン

図 5 (a)に 750 °C で焼成した SiO₂-Co-(acac)₃ 試料の高分解能 TEM 像を示す。TEM 像では,約1 nm 未満の小さなカーボンナノ粒子と,約4 nm の 金属由来のナノ粒子が観察された。図5 (b)に, 同試料の高倍率選択領域電子回折像を示す。これ より、2 つの明瞭な回折スポットが観察され、弱 い結晶性が示唆された.これらの d-space は 4.56 Åであり,既報の Co₃O₄の (111) 面の d-space 4.67 Å とおおよそ一致した。これは XRD 分析によって 検出された Co のピークと一致しており,高温焼成 においても Co の結晶化が抑制され、アモルファ ス構造を維持したと考えられる。



図 5 750 ℃ で焼成した SiO₂-Co-(acac)₃ 試料の TEM 像 (a), 同試料の高倍率選択領域電子回折像 (b)

(2) 各焼成温度で製膜した膜のガス透過特性評価

図 6 に各焼成温度で製膜した SiO₂-Co-(acac)₃ 膜の 200 °C における気体透過率と He/CH₄, He/N₂, C₃H₆/C₃H₈選択性を示す。低分子量ガス(He, H₂, CO₂, N₂, CH₄: 分子径 0.38 nm 以下)の気体透過率は, 250-550 °C で上昇し,550 °C 以上の焼成で減少し たが、C₃H₆(分子径 0.468 nm)の透過率は 300-550 °C の間で大きく変化せず、C₃H₈(0.506 nm)の透 過率は 300 °C で最も高い値を示した。550 °C で焼 成した SiO₂-Co (acac)₃膜はルースな細孔構造を示 し,He 透過率は 3.0 x 10⁻⁶ mol m⁻² s⁻¹ Pa⁻¹を示 した。また、C₃H₆透過率も高く、C₃H₆/C₃H₈選択性 45 を示した。

He 選択性は、高温で製膜するほど高くなり、650

°C で焼成した膜は、He/N₂ 選択性は 120, He/CH₄選 択性は 830 程度を示した. 一方で, 750 °C で焼成 した SiO₂-Co (acac)₃膜では, He 選択性は大きく向 上したが, シリカの緻密化が支配的になり, He 透 過率は大きく低下した。



図 6 各焼成温度で製膜した Si0₂-Co-(acac)₃膜の 200 ℃ に おける気体透過率と He/CH₄, He/N₂, C₃H₅/C₃H₅選択性

図7 にガス透過(He, CH₄)の活性化エネルギ ーに及ぼす焼成温度の影響と、NKP プロット [4] を用い算出した細孔径の関係を示す。250 ℃で焼 成した膜の細孔径は0.50 nm で、550 ℃で焼成し た膜では0.52 nm、750 ℃で焼成した膜では0.39 nmに減少した.250 ℃から550 ℃まで、細孔径 は大きく変化せず、He と CH₄の透過の活性化エネ ルギーもほとんど変化しなかった。一方で、550~ 750 ℃の間では、He と CH₄の活性化エネルギーは いずれも大きく増加し、CH₄の活性化エネルギー は He の値を上回った。焼結による粒界細孔の形 成が抑制され、シャープな細孔径分布を有して いると考えられる。焼成温度を制御パラメータと して、サブナノレベルで幅広い分離系に適した細

孔径制御の可能性が示された。



図7 各焼成温度で製膜したSiO₂-Co-(acac)₃膜の活性化エネ ルギーと細孔径の関係

図8にSi02-Co(acac)3ネットワークの形成にお ける焼成温度の影響の概略図を示す。細孔径の変 化は、高密度に架橋したシリカネットワークの 構造変化と、細孔内に残存する acac 由来の炭素 の構造変化に起因すると考えられる。250-550 ℃ の焼成で、細孔内の有機キレートからケトン基 と一部のカーボンが熱分解し、低分子量ガスの 透過に適した細孔が形成され、He~CH4 の透過率 が上昇したと考えられる。

650 ℃以上の製膜では、各種特性評価より、有 機部分が C-C sp² 結合に変化し、Co が部分的に結 晶化したと考えられる。その結果、緻密化したア モルファスネットワーク構造になり、He、H₂分離 に適した細孔径が形成したと考えられる。



図 8 SiO₂-Co(acac)₃ ネットワークの形成における焼成温度 の影響の概略図

4. 結び

Si-0-Co ネットワークの縮重合度,アモルファ ス構造内のキレート配位子の存在形態,Co の結晶 化などが焼成温度により制御可能であった。ピン ホールレスでの製膜が可能で,サブナノレベルで 幅広い分離系に適した細孔径制御の可能性が示 された。

5. 今後の研究方向性・課題

ガス噴出温度 (80-150℃)で He 選択透過性をさ らに向上させるためには、He の活性化エネルギー と N₂, CH₄ の活性化エネルギー差が大きくなるよ うな構造設計が望ましい。シリカ構造における Co 濃度の最適化について検討する必要がある。また、 混合分離実験を行ない、操作条件が He 分離特性 に及ぼす影響を明らかにする必要がある。

6. 参考文献

[1] Ockwig, N. W., Nenoff, T. M. Membranes
for hydrogen separation. *Chem. Rev.* 2007;
107: 4078-4110.

[2] Lee, D., Oyama S. T. Gas permeation characteristics of a hydrogen selective supported silica membrane. *J. Membr. Sci.* 2002; 210: 291-306.

[3] Lawal, S., Takahashi, Y., Nagasawa, H.,
 Tsuru, T., Kanezashi, M. Microporous
 structure control of SiO₂-ZrO₂ composite

membranes via Yttrium doping and an evaluation of thermal stability. *J. Sol-Gel Sci. Technol.* 2022; 104: 566-579.

[4] Lee, H. R., Kanezashi, M., Shimomura, Y., Yoshioka, T., Tsuru, T. Evaluation and fabrication of pore-size-tuned silica membranes with tetraethoxydimethyl disiloxane for gas separation. *AIChE J.* 2011; 57: 2755- 2765.

7.謝辞

本研究の遂行にあたり,一般財団法人向科学技 術振興財団より多大なご支援を頂きましたこと を深く御礼申し上げます。